

## میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy)



- ❖ خواص قابل اندازه‌گیری با این دستگاه شامل مورفولوژی هندسی، توزیع چسبندگی، اصطکاک، ناخالصی سطحی، جنس نقاط مختلف سطح، کشسانی، خواص مغناطیسی، بزرگی پیوندهای شیمیایی، توزیع بارهای الکتریکی سطحی، و قطبیت الکتریکی نقاط مختلف می‌باشد.
- ❖ امکان عملکرد دستگاه در مدهای مختلف.
- ❖ امکان بررسی سطوح رسانا یا عایق، نرم یا سخت، منسجم یا پودری، بیولوژیک و آلی یا غیرآلی
- ❖ جابه‌جایی نمونه در دو جهت عرض و طول با استفاده از نرم افزار سیستم پردازش تصاویر

### ثبت درخواست

برای ثبت درخواست انجام آزمون یکی از دو روش زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. مراجعه حضوری و تحویل نمونه (ها) در نشانی زیر (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ به جز ایام تعطیل).
۲. ارسال فرم ثبت درخواست به همراه نمونه (ها) در نشانی زیر. لطفاً قبل از ارسال با مرکز تماس بگیرید (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ به جز ایام تعطیل).

**آدرس:** تهران، خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک)، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات فناوری نانو.